

Atechnaの低分散ミラーは
わずか $-10\text{fs}^2 \sim 10\text{fs}^2$ の分散量でありながら、
高い反射率(最大99.5%)をもちます。

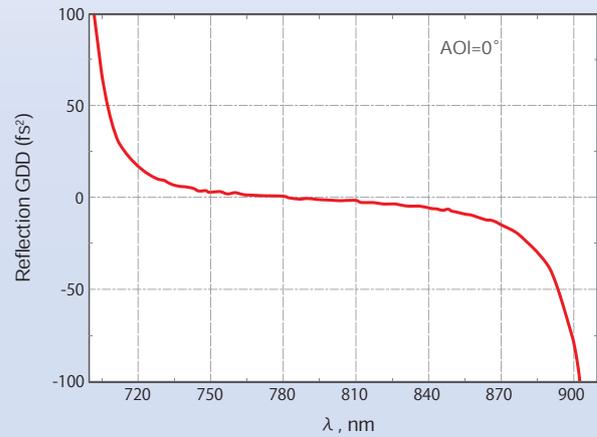


標準仕様

外径：φ12.5, φ25.4, φ50.8
 外径公差：+0/-0.1 mm
 厚さ公差：±0.1 mm
 有効径：> 90 %
 スクラッチディグ：20 ~ 10 S-D
 面精度：< $\lambda/8 @ 632.8 \text{ nm}$
 GDD(s偏光)：-10 fs² to 10 fs²
 GDD(p偏光)：-20 fs² to 20 fs²
 面取り：< 0.25 mm × 45°
 付着力及び耐久性：Per MIL-C-675A
 ※特注対応も可能です。

GDD特性

BBHRsp @ 760~840nm, AOI=0 deg



反射率

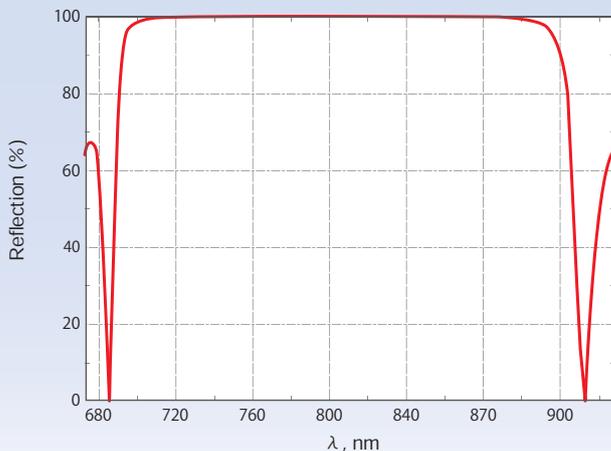
入射角0° (φ12.5, φ25.4で共通です。φ50.8は一部のみ)

波長 (nm)	250 ~ 270	340 ~ 370	380 ~ 420	500 ~ 532	760 ~ 840	1000 ~ 1060
反射率 (%)	>99.0	>99.5	>99.5	>99.5	>99.5	>99.5

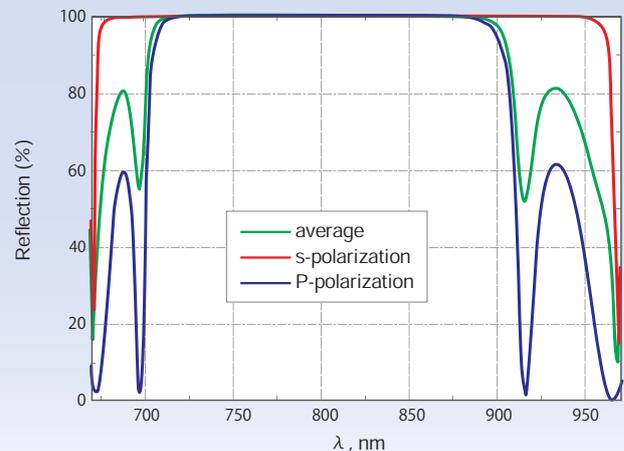
入射角45° (φ12.5, φ25.4, φ50.8共通です)

波長 (nm)	250 ~ 270	340 ~ 370	380 ~ 420	500 ~ 532	760 ~ 840	1000 ~ 1060
反射率 s / p (%)	>99.0	>99.5	>99.5	>99.5	>99.5	>99.5

BBHR>99.5% @ 760~840nm, AOI=0 deg



BBHR>99.5% @ 760~840nm, AOI=45 deg



アルテクナはリトアニア国にある高品質のレーザ用光学部品を提供する急成長中のメーカーです。

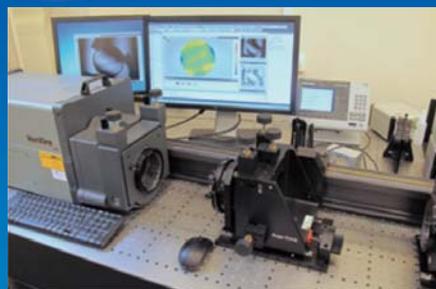
2000m²の広大な近代的なテクノロジーパークを持ち、お客様の仕様に合わせて設計から製造まで一貫して製作することもできます。

また、最先端の電子ビーム蒸着装置、スパッタリング装置を保有し、優れた品質管理体制も整っております。

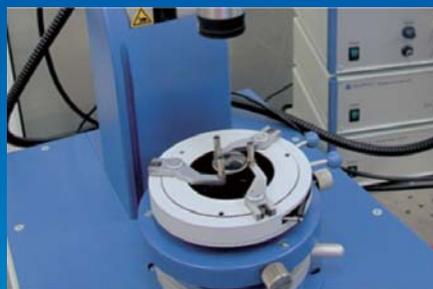


品質管理体制

Altechnaは品質管理を最も重要視しております。
多様な高精度の測定機器を用いてその品質を保っております。



干渉計



高精度レンズ測定器



ゴニオメーター



郡遅延分散測定器



スペクトロメーター



スクラッチディグ測定器